LGA50 光学器件分析系统

昊衡科技
Megasense

产品特点

- 空间分辨率：10μm
- 测量长度：50m
- 波长范围：1525~1625或1265~1340nm
- 插损、回损分析

产品应用

- 无源器件插损、回损测量
- 硅光芯片插损、回损测量
- 平面波导器件测试
- 光学链路分析、诊断



产品描述

LGA50光学器件分析系统具有功能齐全、性价比高等特点，可实现光器件、光模块等光学链路全范围插损、回损、长度的精确测量。长度测量范围为50m，精度可达毫米量级，空间分辨率为10μm，适用于定量分析、品质检测及故障诊断。

产品参数

类别	指标	单位
测量长度[1]	50	m
空间分辨率	10	μm
波长范围	1525~1625或1265~1340	nm
波长精度	1.0	pm
回损动态范围	70	dB
回损测量范围	-125~0	dB
回损灵敏度	-130	dB
回损测量精度	±0.5	dB
回损分辨率	±0.05	dB
插损动态范围[2]	15	dB
插损测量精度	±0.2	dB
测量时间	< 12	s
输入电压	AC 220/110V; DC 12V	-
主机功率	60	W
通讯接口	USB	-
光纤接口	FC/APC	-
尺寸	W345*D390*H165	mm
重量	7.5	kg
储存温度	0~50	℃
工作温度	10~40	℃
储存与工作湿度	10~70	%RH
选配功能[3]		
采集频率	5Hz@(20m,42nm)　15Hz@(20m,10nm)	-

备注：

1. LGA50测量长度为50m ，可选配100m@20μm；
2. 插损动态范围是指标准单模光纤其散射水平被本底噪声淹没之前的最大来回损耗；
3. 选配功能需单独购买。

武汉昊衡科技有限公司
电 话：027-87002165　邮 箱：sales@mega-sense.com　网 址：www.mega-sense.com
地 址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号武汉未来科技城B4栋14楼(430206)
产品技术规格如有变更，恕不另行通知，如有疑议，请与我司联系。